

Pressemitteilung

Internationale Konferenz im Mai feiert das 25-jährige Bestehen der Berliner LUM GmbH

Berlin, 26.04.2019:

Die LUM GmbH ist ein führender internationaler Anbieter für innovative Messtechnik der Dispersionsanalyse und Materialtestung. Seit der Gründung durch Prof. Dr. Dr. D. Lerche im Jahre 1994 ist LUM auch einer hohen Wissenschaftlichkeit verpflichtet und trägt durch die Förderung von Wissenschaft und Technik als auch durch eigene Beiträge zur Weiterentwicklung auf den Kompetenzfeldern Partikelcharakterisierung, Suspensions- und Emulsionsanalyse und Stabilitätsbeurteilung als auch Bestimmung der Füge- und Schichtfestigkeit bei. Ein besonderes Anliegen für LUM ist die weltweite Vernetzung der Anwender von LUM-Messgeräten aus Industrie und Wissenschaft.

Vom 22. bis 23. Mai 2019 feiert LUM mit der 9. Internationalen Konferenz zur Dispersionsanalyse und Materialtestung in Berlin ihr 25-jähriges Bestehen. Das finale Programm lädt Partikelforscher, Dispersions- und Emulsionsformulierer, Materialprüfer aus aller Welt nach Berlin zum Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Die Keynote Lecture zum Thema „Progress in particle characterization by sedimentation analysis“ wird von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Peukert, FAU Erlangen-Nürnberg gehalten. Über die Partikelcharakterisierung durch Hansen Dispersibility Parameter unter Nutzung der Messgeräte LUMiReaderPSA und LUMiSizer spricht Shin-ichi Takeda aus Japan. Vom erfolgreichen Einsatz der analytischen und der Ultrazentrifugation zur Partikelcharakterisierung und Dispersionssedimentation berichten weiter Forscher der Universitäten Leeds, UK, und Utrecht, NL.

Inbesondere an industrielle Anwender in der kosmetischen und chemischen Industrie richten sich die Beiträge von Colgate-Palmolive, USA, Wacker Chemie, DE und der TU Brno, die über die schnelle, direkte beschleunigte Stabilitätstestung von Cremes und Silikonformulierungen bis hin zur Lagerstabilitätsvorhersage für Verbraucherprodukte sprechen. Hier kommen die bekannten Messgeräte LUMiFuge und LUMiSizer zum Einsatz.

Pigmentformulierungen und Tinten bilden einen weiteren Konferenzschwerpunkt.

Die Kombination von beschleunigter Separation und Echtzeitröntgenanalyse (LUMiReader X-Ray) von Titandioxid ergeben den Schwerpunkt des Beitrags von Kronos International, Inc. Die Echtzeitanalyse mittels optischer Mehrwellenmesstechnik im LUMiReader PSA wird von HP Indigo, Israel, zur

Pressemitteilung

Charakterisierung von *Liquid ElectroPhotography*-Tinten genutzt. Die Stabilitätsvorhersage von Tintenstrahl-tinten mittels LUMiSizer ist auch das Thema von HP Inc. in den USA.

Der großen Nachfrage nach LUM-Messtechnik in der Lebensmittelindustrie wird in zwei Sessions Rechnung getragen. Drei Nachwuchsforscher bewerben sich um den LUM Wissenschaftspreis YSA 2019 mit Themen zu Erbsenprotein, Nanogelen und Partikelhaftung von Mehl. Pepsico Russia und die Universität Saskatchewan, Canada, stellen in einer anderen Session ihre Erfahrungen vor. Die Berliner Firma Optoshere hat die offline und inline-Bestimmung von Fett, Protein und Trockenmasse in Milchprodukten mit dem neuesten LUM-Produkt LUMiFlector zum Thema.

Das analytische Zentrifugen auch umfänglich zur Zug- und Druckprüfung eingesetzt werden können, ist seit der Produkteinführung des LUMiFrac bekannt. Über neueste Erkenntnisse berichtet hierzu die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Dass der LUMiFrac auch zum Mikrokontakt-druck von Partikeln genutzt werden kann, veranschaulicht erstmals der Redner vom Fraunhofer IAP.

Mit insgesamt 25 Beiträgen an zwei Tagen stehen Experten den Zuhörern Rede und Antwort. Das traditionelle Rahmenprogramm, diesmal eine Spezialführung im Berliner Tierpark, dem größten Landschaftstiergarten Europas, rundet die Veranstaltung ab.

Registrierung und Details zur Konferenz:

https://conference2019.lum-gmbh.com/conference_2019.html

Konferenzabstracts: <https://www.dispersion-letters.com/>

Pressekontakt

LUM GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 12489 Berlin, Germany, Tel. +49-30-6780 6030, support@lum-gmbh.de, www.lum-gmbh.com